【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成17年9月15日(2005.9.15)

【公開番号】特開2003-43119(P2003-43119A)
【公開日】平成15年2月13日(2003.2.13)
【出願番号】特願2002-99870(P2002-99870)
【国際特許分類第７版】
　Ｇ０１Ｒ　31/28
　Ｇ０６Ｆ　11/22
【ＦＩ】
　Ｇ０１Ｒ　31/28　　Ｇ
　Ｇ０６Ｆ　11/22　　３６０Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成17年3月29日(2005.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上のデバイスを有する１以上のスキャンパスを備えたターゲットシステムをテストするためのテストシステムであって、
　　特定デバイスを有する前記ターゲットシステムの１以上のスキャンパスの中にスキャンイメージをスキャンするスキャン手段であって、前記ターゲットシステムの１以上のスキャンパスの中に前記スキャンイメージをパラレルにスキャンすることが可能なスキャン手段と、
　　前記スキャン手段に接続され、デバイスタイプに関するデバイステストデータを有するパターンファイルを処理し、前記ターゲットシステムのデバイスに特有のデバイステストデータを有するスキャンイメージを前記スキャン手段に提供する処理手段であって、前記パラレルスキャンパスのそれぞれについて前記特定デバイスタイプを識別する識別手段を含む、処理手段と、
　前記デバイスの中に前記デバイステストデータをスキャンするために、前記スキャン手段が提供された前記スキャンイメージを前記特定デバイスタイプのデバイスを含む前記ターゲットシステムの１以上のパラレルスキャンパスの中にパラレルにスキャンすることを可能にする手段と、
　からなるテストシステム。
【請求項２】
　前記識別手段は、パラレルデバイスツリーを用いて実施され、
　前記パラレルデバイスツリーは、該パラレルデバイスツリーを前記特定デバイスタイプに関連付けるためのデバイスタイプセレクションを有する、請求項１に記載のテストシステム。
【請求項３】
　前記パラレルデバイスツリーは、前記デバイスタイプセレクションの下に１以上のデバイスグループをさらに含み、該デバイスグループのそれぞれが、ターゲットシステム内のパラレルスキャンパスに対応する１以上のデバイスリストを有する、請求項２に記載のテストシステム。
【請求項４】

前記デバイスツリーは、少なくとも１つのリンクされたリストデータ構造を用いて実施される、請求項２に記載のテストシステム。